

TESCAN SOLARIS 2

來自歐洲捷克：具有優異奈米加工能力的超高解析FIB-SEM

TESCAN SOLARIS 2 是一款全自動 Ga FIB-SEM，專為高精度TEM樣品製備而設計，搭載人工智慧驅動的 TEM AutoTEM Pro™ 軟體。此系統適用於故障分析、研發和品質控制，無縫整合先進的 SEM 和 FIB 校準，確保系統的一致就緒性並縮短獲取資料的時間。

SOLARIS 2 能出色的處理各類電子元件，包括最新的邏輯、記憶體、電源和顯示技術，為您提供可靠的樣品製備性能。



FIB-SEM 解決方案優勢

快速、精準的 TEM 樣品

- 使用 TESCANA TEM AutoPrep™ Pro，可在一小時內製作出10奈米以下的超薄 TEM 樣品，從取出到最後的 FIB 拋光皆為全自動化操作，每次都能提供始終如一的卓越效果。

先進設備的精確定位

- 使用 AI人工智慧驅動的基準點標記識別和 Triglav™ SEM 鏡筒的高解析度成像，精準瞄準 GAA 或 FinFET 器件中的單晶體管線，並配備先進的 SE 和 BSE 偵測器，增強光束重合點的對比度。

使用 OptiLift™ 進行適應性薄片製備

- 使用 OptiLift™ 奈米操縱器輕鬆製備自上而下、平面和倒置的薄片，這種創新設計無需額外的翻轉設備，從而簡化您的工作流程。

隨時待命，精確對位

- 自動電子鏡筒和離子鏡筒校準系統可在夜間運作，讓系統保持就緒狀態，確保最少的設定和最長的正常運作時間。

卓越的高解析度成像技術

- Triglav™ SEM 掃描電鏡鏡筒專為超高解析度成像而設計，可提供出色的表面靈敏度和對比度，使其成為光束敏感材料的理想選擇。

有效優化工作效率

- 重新設計的TESCAN TEM AutoPrep™ Pro可為任何TEM樣品工作流程提供直覺式的流程導航和廣泛的自訂功能，從而提高每個使用者的工作效率。

Contact us

新竹市東區水源街95號
+886 3 573 8099 #1078
marketing@spirox.com

